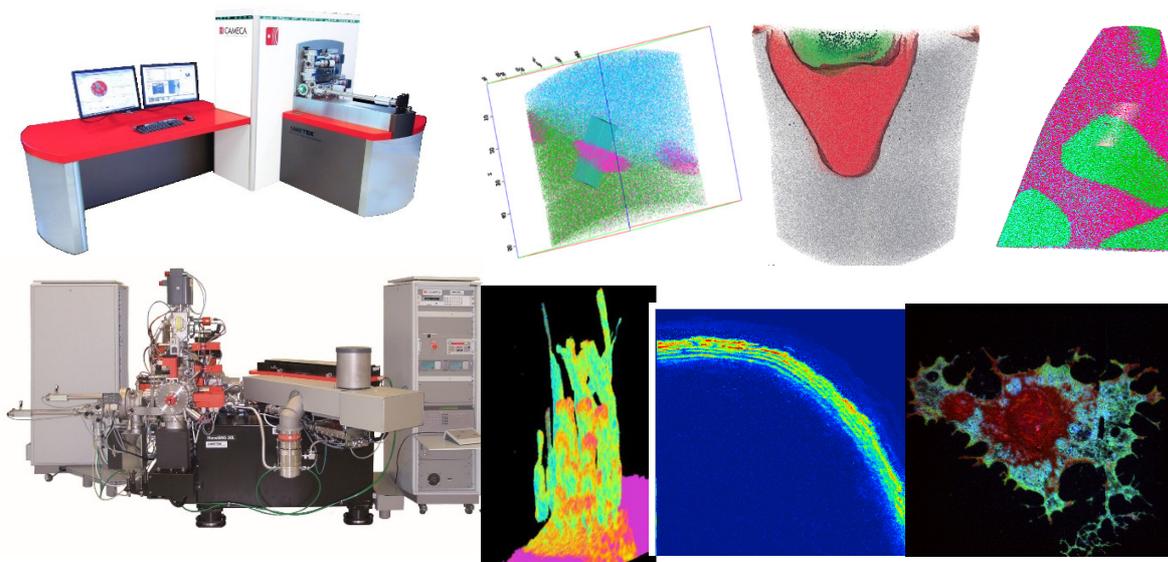


Семинар

Атомно-зондовая томография и масс-спектрометрия вторичных ионов в исследовании наноразмерных систем

19 мая 2016 г.



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре “Атомно-зондовая томография и масс-спектрометрия вторичных ионов в исследовании наноразмерных систем”. Семинар ставит перед собой задачу ознакомить слушателей с последними достижениями в области элементного и изотопного нано- и микроанализа.

Семинар ориентирован на ученых и преподавателей, работающих в области Физики, Химии, Материаловедения, Геологии и Биологии.

Организатор мероприятия:

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159

Регистрация

Просим подтвердить Ваше участие в семинаре
до 13 мая 2016 по электронной почте

igor.fedik@ametek.com





Программа семинара

9.00 – 10.00	<i>Регистрация</i>
10.00-10.10	<i>Открытие семинара</i>
10:10-10:50	Обзор линейки CAMECA
10:55-11:40	Введение в метод атомно-зондовой томографии. Технология
11:40-12:00	<i>Кофе-пауза</i>
12:00-13:30	Приложения метода атомно-зондовой томографии: от материаловедения до геологии и биологии
13.30-14.30	<i>Фуршет</i>
14:30-15:15	Масс-спектрометр вторичных ионов NanoSIMS. Технология
15:15-16:45	Приложения NanoSIMS: суб-микронный элементный и изотопный анализ высокой чувствительности в задачах материаловедения, гео- и космохимии и биологии
16:45-17:00	<i>Кофе-пауза</i>
16:00-17:30	Обсуждение

Приглашенные докладчики:

Секция атомно-зондовой томографии:
Peter Clifton – **CAMECA USA**

Секция масс-спектрометрии вторичных ионов:
Philippe Saliot – **CAMECA FRANCE**

Информационная поддержка:

ОПТЭК

105005, Россия, г. Москва, Денисовский пер., 26

тел.: (495) 933 51 51

e-mail: office@optecgroup.com

Представитель ОПТЭК в Дальневосточном регионе

Тел. +7 (914) 706 34 70

e-mail: office-vld@optecgroup.com